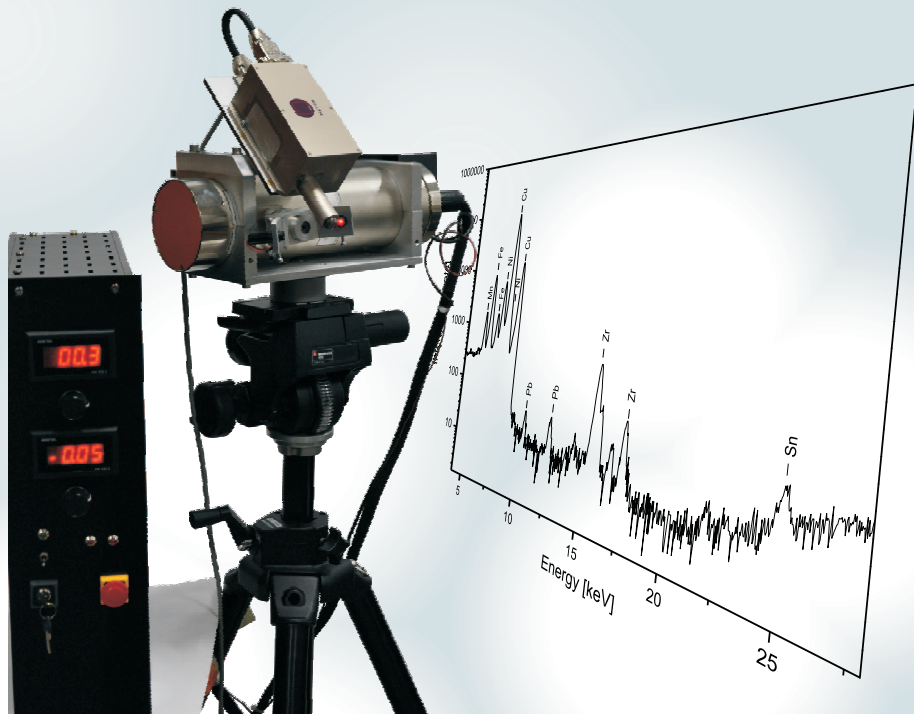




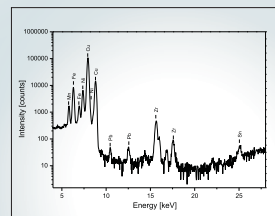
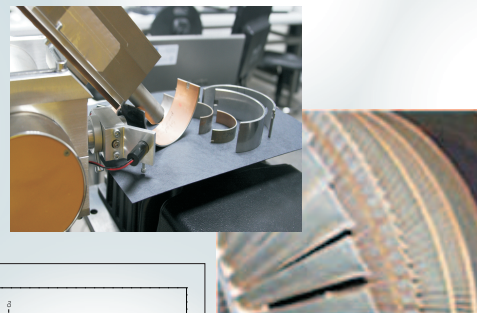
Zakład Fotofizyki
Instytut Maszyn Przepływowych
im. Roberta Szewalskiego PAN

ul. Fiszer 14, 80-231 Gdańsk,
www.imp.gda.pl/photophysics
 tel. (058)6995294

Analizy

Przemysł

Szybka i precyzyjna analiza zawartości domieszek - do kontroli i monitorowania składu chemicznego w przemyśle i produkcji.



Przenośny spektrometr XRF

Przeznaczenie

- nieinwazyjne i bezkontaktowe określanie składu pierwiastkowego
- natychmiastowa analiza materiałów w przemyśle, badaniach środowiska, konserwatorskich, kryminalistyce
- materiały badane: metale i stopy, szkła, ceramika, pigmenty, itp.

Oferujemy wykonania specjalne spektrometru

Dane techniczne

- czułość instrumentu: 60 - 150 ppm
- głębokość penetracji $\sim 10 - 90 \mu\text{m}$, zależna od materiału
- ogniskowanie/rozdzielczość przestrzenna 4;3;2 mm (wybieralna kolimatorami)
- zakres pomiarowy Z_A : K (19) - U (92)
Na (11) - U (92) z osłoną He
- rozdzielczość energetyczna - 155 eV dla linii 5,9 keV Mn K_{α}
- czas zliczania pojedynczego widma ~ 120 s
- wzbudzenie : lampa rentgenowska (anoda - Wo ; U_A : 20 - 60 kV)
- detektor: SDD chłodzony termoelektrycznie, pozycjoner laserowy

Badania obiektów zabytkowych

Określenie składu historycznych materiałów, pigmentów; wysoka czułość umożliwia analizę nawet śladowych ilości substancji na powierzchni.

